

- [6] Neelmani J., Verma G. S. // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. N 9. P. 3509—3514.
 [7] Callaway J. // Phys. Rev. 1959. V. 113. N 4. P. 1046—1051.
 [8] Hakuraku Y. // Jpn. J. Appl. Phys. 1983. V. 22. N 9. P. 1465.
 [9] Numazawa T., Watanabe Y., Hashimoto T., Sato A., Nakagame H., Horigami O., Takayama S., Watanabe M. // Proc. IV Int. Criog. Engin. Conf. 1982. P. 30—33.
 [10] Daudin B., Lagnier R., Salce B. // J. Magn. Materials. 1982. V. 27. N 3. P. 315—322.

Брянский государственный
педагогический институт
Брянск

Поступило в Редакцию
24 апреля 1989 г.

УДК 539.214 : 620.191

Физика твердого тела, том 31, в. 10, 1989.
Solid State Physics, vol. 31, N 10, 1989

ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ LiF С НАРУШЕННЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ

C. B. Лубенец, Л. С. Фоменко

Механические свойства твердых тел отличаются чувствительностью к характеру окружающей среды и к состоянию приповерхностного слоя [1—6]. В данной работе обнаружено и проведено предварительное изучение влияния тонкой шлифовки поверхности на параметры деформационного упрочнения монокристаллов LiF и прежде всего на величину предела текучести, качественно исследована картина развития дислокационной структуры на участке микропластичности, продемонстрирована возможность управления процессом формоизменения образца, с помощью шлифовки реализовано одиночное скольжение.

Кристаллы LiF-2 [7, 8] при комнатной температуре имели предел

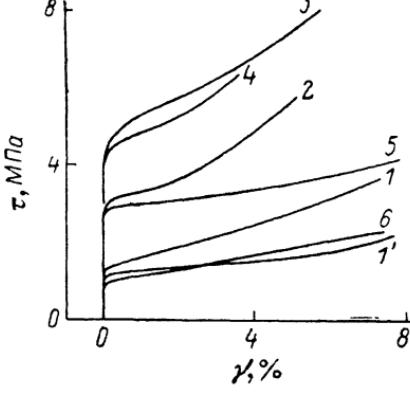


Рис. 1. Диаграммы деформации нешлифованных (1, 1') и шлифованных (2—6) образцов кристалла LiF-2.

размеры поперечного сечения $a \times b$ (мм): 2.03×3.55 (1), 1.95×3.4 (1'), 2.78×3.03 (2), 1.78×2.49 (3), 1.52×2.58 (4; шлиф. широкие грани), 1.79×2.61 (5; шлиф. узкие грани), 3.05×4.17 (6; шлиф. для одиночного скольжения).

текущести $\tau_0 = 1.1 \pm 0.15$ МПа. Боковые грани образцов прямоугольного сечения с размерами от 1.5×2.5 до 3×4 мм и высотою 9—11 мм шлифовали вручную на стеклянной пластинке, смачиваемой взвесью абразивного порошка М-1 в керосине. После шлифовки образцы промывали в ацетоне. Деформирование сжатием проводили при комнатной температуре со средней скоростью сдвиговой деформации $\dot{\gamma} \approx 3 \cdot 10^{-4}$ с⁻¹.

На рис. 1 показаны характерные диаграммы деформации. Кривые 1, 1' являются граничными для нешлифованных образцов в отношении предела текучести $\tau_0 \pm \Delta \tau$ и коэффициентов упрочнения $\theta \pm \Delta \theta$. Отличительные особенности кривых деформационного упрочнения шлифованных образцов заключаются в следующем.

1. Наличие искаженного поверхностного слоя приводит к увеличению предела текучести τ_0^w , которое зависит от площади поперечного сечения образца. Например, для кривой 2 отношение $\tau_0^w / \tau_0 \approx 2.6$ и ~ 3.8 для кривой 3.

2. Эксперименты показали, что упрочняющее влияние нарушенной поверхности сильнее выражено для исходно мягких кристаллов и ослабевает с увеличением их жесткости. Например, для образца кристалла LiF : Mg²⁺ ($\tau_0 = 3.6 \pm 0.15$ МПа), имевшего почти те же размеры, что и образец LiF-2 (кривая 3), относительное увеличение $\tau_0^w / \tau_0 \approx 1.6$. Эффект упрочнения уменьшается также при понижении температуры.

3. Шлифованием поверхности (рис. 1) можно изменять протяженность стадий деформационного упрочнения и величину коэффициентов θ_I и θ_{II} . Для шлифованных образцов характерной является переходная (после упругой) стадия параболического упрочнения протяженностью до 1 % сдвиговой деформации (ср. кривые 1 и 3), что может быть косвенным свидетельством развития множественного скольжения в области предела текучести. Первая стадия становится короче. Для кристаллов LiF-2

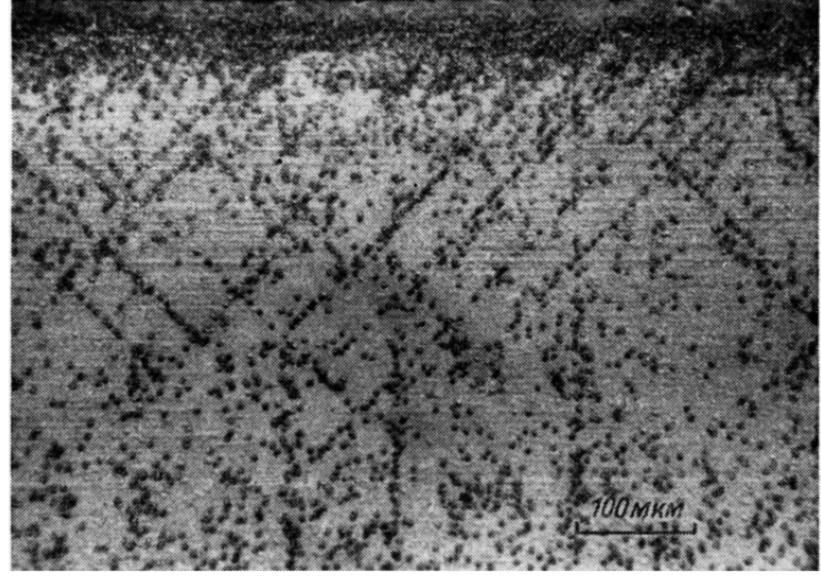


Рис. 2. Дислокационная структура шлифованного образца кристалла LiF-2, нагруженного до $\tau = 1.2$ МПа.

Протравлена плоскость, параллельная оси сжатия. Шлифованная поверхность слева.

θ_I увеличивается в среднем на 30—40 %, а θ_{II} в 2.3—2.4 раза. В то же время для образцов, у которых шлифованы только две узкие грани, характерно скольжение с малой скоростью упрочнения (кривая 5).

4. Анализ формы деформированных образцов и характера дислокационной структуры показывает, что скольжение всегда протекает по системам с вектором Бюргерса, параллельным шлифованым граням. Поэтому если шлифованы четыре грани, то образец принимает форму бочки, две широкие грани — форму двусторонней бочки, две узкие — S-образную форму. Одним из интересных примеров управления процессом формоизменения образца является реализация одиночного скольжения. Для этого достаточно сохранить нешлифованным слой материала (как в [9], необлученный слой), где при нагружении и осуществляется сдвиг в основном по одной запрограммированной системе. Диаграмма деформации подобного образца показана на рис. 1, б.

Типичная картина травления шлифованного образца, нагруженного до напряжения $\tau \approx \tau_0$, показана на рис. 2. Плотность дислокаций в нарушенном слое (слева) высокая, так что отдельные фигуры травления не разрешаются. Толщина слоя ($3 \div 3.5 \cdot 10^{-3}$ см). Средняя плотность дислокаций в объеме кристалла ($\sim 2 \cdot 10^6 \text{ см}^{-2}$) такая же, как и в нешлифованном образце при этом напряжении. Однако уже при $\tau = \tau_0^w$, когда фиксируется остаточная деформация, она достигает значения $\sim 2 \cdot 10^7 \text{ см}^{-2}$.

Таким образом, в шлифованном образце в области микротекучести разыгрываются дислокационные процессы, которые в обычных условиях охватывают первую и значительную часть второй стадии деформации [9].

Причина сильного упрочнения образцов с нарушенной поверхностью, очевидно, обусловлена специфическим самосогласованным развитием дислокационной структуры. Нарушенный слой играет двоякую роль, будучи источником дислокаций и барьером для их выхода из образца, обеспечивая протекание скольжения в стесненных условиях. Это приводит к росту внутренних напряжений и соответственно к подъему уровня внешнего напряжения, требуемого для начала макроскопического пластического сдвига.

В заключение отметим, что управление с помощью нарушенного поверхностного слоя процессом формоизменения, степенью активности нагруженных систем скольжения, величиной предела текучести, уровнем деформирующих напряжений открывает дополнительные возможности в исследовании закономерностей формирования специальных дислокационных структур, их устойчивости и взаимосвязи с параметрами деформационного упрочнения.

Авторы выражают благодарность В. Д. Нацуку, В. З. Бенгусу, Ф. Ф. Лаврентьеву, В. А. Москаленко и Л. М. Сойферу за полезные дискуссии.

Список литературы

- [1] Ioffe A., Kirpitschova M., Levitsky M. // Z. Phys. 1924. Bd 22. S. 286—302.
- [2] Rebindler P. // Z. Phys. 1932. Bd 72. S. 191—205.
- [3] Лихтман В. И., Щукин Е. Д., Ребиндер П. А. Физико-химическая механика металлов. М., 1962. 303 с.
- [4] Surface effects in crystal plasticity. Series E: Applied Science. N 17 / Ed. R. M. Latanision and J. T. Fourie. Noordhoff—Leyden, 1977. 944 p.
- [5] Алексин В. П. Физика прочности и пластичности поверхностных слоев материалов. М., 1983. 280 с.
- [6] Физика и технология упрочнения поверхности металлов // Тез. докл. III засед. постоянного семинара «Физико-технологические проблемы поверхности металлов». Л., 1984. 104 с.
- [7] Lubenets S. V., Ostapchuk E. I., Soifer L. M., Appel F., Kaufmann H.-J. // Cryst. Res. Technol. 1984. V. 19. N 3. P. 349—356.
- [8] Кауфманн Х.-Й., Лубенец С. В., Нацук В. Д., Пустовалов В. В., Фоменко Л. С., Шумилин С. Э. // ФНТ. 1988. Т. 14. № 6. С. 625—632.
- [9] Смирнов Б. И. Дислокационная структура и упрочнение кристаллов. Л., 1981. 236 с.

Физико-технический институт
низких температур АН УССР
Харьков

Поступило в Редакцию
24 апреля 1989 г.

УДК 548.0 : 537.635

Физика твердого тела, том 31, в. 10, 1989
Solid State Physics, vol. 31, N 10, 1989

ЭПР РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В БЕРИЛЛЕ

В. П. Солнцев, Г. Г. Храненко

Полученная в последнее время при 300 К плавноперестраиваемая генерация стимулированного излучения [1, 2] на электронно-колебательных переходах Cr^{3+} в берилле ($\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$) способствовала дальнейшему исследованию других активаторов (Ni^{2+} , Co^{2+}) и ионов компенсаторов в этой матрице. Известно, что примесные ионы в берилле предпочтительно занимают октаэдрические позиции Al [3]. Поэтому для получения устойчивого двухвалентного состояния активаторных ионов необходима компенсация заряда.